

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректор по учебной и научной работе

Дата подписания: 31.07.2023 14:21:02

Уникальный идентификатор документа:

d7a26b9e8ca85e98ec3de2eb454b4659d061f249

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Квантовая и оптическая электроника

Закреплена за подразделением

Кафедра технологии материалов электроники

Направление подготовки

11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА

Профиль

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 180

Формы контроля в семестрах:

в том числе:

экзамен 6

аудиторные занятия 68

самостоятельная работа 76

часов на контроль 36

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	6 (3.2)		Итого	
	Неделя			
	18			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	17	17	17	17
Лабораторные	17	17	17	17
Практические	34	17	34	17
Итого ауд.	68	51	68	51
Контактная работа	68	51	68	51
Сам. работа	76	66	76	66
Часы на контроль	36	36	36	36
Итого	180	153	180	153

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1	Сформировать понимание математического аппарата квантовой механики, применяемого для описания физических основ электроники и физической оптики.
1.2	Углубить знания теории измерений, применяемых в квантовой области.
1.3	Ознакомить с теорией квантовых переходов, применяемых для описания процессов генерации лазерного излучения.
1.4	Ознакомить с принципами дифракционного рассеяния и оптической модели частиц. Рассмотреть аналитические свойства матрицы рассеяния.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП:		Б1.В.ДВ.02
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике	
2.1.2	Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике	
2.1.3	Статистическая физика	
2.1.4	Физические свойства кристаллов	
2.1.5	Методы математической физики	
2.1.6	Основы квантовой механики	
2.1.7	Практическая кристаллография	
2.1.8	Учебная практика по получению первичных профессиональных умений	
2.1.9	Учебная практика по получению первичных профессиональных умений	
2.1.10	Физика	
2.1.11	Физическая химия	
2.1.12	Математика	
2.1.13	Органическая химия	
2.1.14	Химия	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Ионно-плазменная обработка материалов	
2.2.2	Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники	
2.2.3	Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем	
2.2.4	Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ	
2.2.5	Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок	
2.2.6	Оформление результатов научной деятельности	
2.2.7	Полевые полупроводниковые приборы	
2.2.8	Приемники оптического излучения	
2.2.9	Физика импульсного отжига	
2.2.10	Физико-математические модели процессов наноэлектроники	
2.2.11	Физические основы электроники	
2.2.12	Вакуумная и плазменная электроника	
2.2.13	Квантоворазмерные структуры в наноэлектронике	
2.2.14	Магнитные измерения	
2.2.15	Математические модели технологических процессов получения магнитоэлектроники и радиокерамики	
2.2.16	Моделирование технологических процессов получения материалов электронной техники	
2.2.17	Оборудование производства ферритовых материалов и радиокерамики	
2.2.18	Основы технологии электронной компонентной базы	
2.2.19	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
2.2.20	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
2.2.21	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы	
2.2.22	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы	
2.2.23	Приборы квантовой и оптической электроники	
2.2.24	Процессы вакуумной и плазменной электроники	
2.2.25	Светоизлучающие полупроводниковые приборы	

2.2.26	Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ	
ПК-4: Способность обрабатывать результаты измерений опытных образцов изделий электронной техники	
Знать:	
ПК-4-31 Применение аппарата квантовой механики в лазерной технике.	
ПК-3: Способность проводить предварительные измерения опытных образцов изделий электронной техники	
Знать:	
ПК-3-31 Понятный аппарат квантовой механики	
ОПК-1: Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности	
Знать:	
ОПК-1-31 методы естественных наук	
ПК-4: Способность обрабатывать результаты измерений опытных образцов изделий электронной техники	
Уметь:	
ПК-4-У1 Анализировать решения задач механики квантовой частицы.	
ПК-3: Способность проводить предварительные измерения опытных образцов изделий электронной техники	
Уметь:	
ПК-3-У1 Решать модельные задачи механики квантовой частицы	
ОПК-1: Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности	
Уметь:	
ОПК-1-У1 использовать положения естественных наук	
ПК-4: Способность обрабатывать результаты измерений опытных образцов изделий электронной техники	
Владеть:	
ПК-4-В1 Методами научного познания при решении профессиональных задач в области квантовой механики.	
ПК-3: Способность проводить предварительные измерения опытных образцов изделий электронной техники	
Владеть:	
ПК-3-В1 Формами научного познания при формулировании профессиональных задач в области квантовой механики.	
ОПК-1: Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности	
Владеть:	
ОПК-1-В1 законами математики для решения задач инженерной деятельности	